



Inline measurement equipment list

杭州中晶电子科技有限公司产品检验措施

Items	Testing Content	检测内容	Tool Name	测量工具	where check	检测发生地	Frequency	频度
1	Curie Temperature	居里温度	DSC3100		外协	outsourced	由客户提供每批货的居里温度报告，每批次中抽一根晶体的头尾 The Curie temperature report for each batch will be provided by the supplier each pieces of top and tail from one boule will be reported per crystal 100%	
2	Orientation /Notch	晶向	X-Ray (YX-CZ)		本公司	in house	wafering 2pcs/ingot before and after slicing crystal 100%	
3	Flat Width	各个基准边	Caliper		本公司	in house	crystal 100% wafering 2pcs/cassette	
4	Diameter	圆晶直径	automatic digital edge rounding		本公司	in house	crystal 100% wafering 2pcs/cassette	
5	Edge Profile	晶片边缘	the same as above		本公司	in house	2pcs/cassette	
6	Thickness	圆晶厚度	1) Spiral micrometer 2) Automatic Optical Tool		本公司	in house	2pcs/cassette on slicing 1pcs/lot on lapping 2pcs/lot on grinding	
7	Backside surface roughness	晶片背面粗糙度	三维测量显微镜 Micro1000		本公司	in house	1pcs/lot	
8	Front surface roughness	晶片主面粗糙度	三维测量显微镜 Micro1000		本公司	in house	please refer to*	
9	Conductivity	电导率测量	Resistance tester (PC68) 数字型高阻仪		本公司	in house	1pcs/lot	
10	Blacken	黑化度检测	Spectrophotometer (CS-580A)		本公司	in house	5pcs/lot on blacking process 100% after CMP	
12	Warp/BOW	平面度测量	flatmaster 200 by Trapel		本公司	in house	100%	
13	TTV/PLTV	平面度测量	flatmaster 200 by Trapel		本公司	in house	100%	
14	%LTV(LTV ≤ 0.5um)	平面度测量	flatmaster 200 by Trapel		本公司	in house	100%	
15	Surface Defects/ (include particle)	圆晶表面损伤缺陷	AUTOMATIC OPTICAL INSPECTION 自动光学缺陷检测机		本公司	in house	100%	